

COPT 

ZENTRUM FÜR ORGANISCHE ELEKTRONIK | UNIVERSITÄT ZU KÖLN

DATENBLATT

Nadel-Profilometer

Bruker Corporation

Dektak XT



copt-zentrum.de



Technische Daten

Nadel-Profilometer

Firma

Bruker Corporation

Modell

Dektak XT

Anwendung:

Taktile Bestimmung der Oberflächentopographie (Schichtdicke, Welligkeit und Rauigkeit...) und 3D-Mapping von festen Oberflächen

Auflagekraft:

1 bis 15 mg mit LIS 3 Sensor

Messlänge:

55 mm (durch verbinden bis 200 mm)

Max. Probengröße (B x L x H):

200 x 200 x 50 mm³

Nadelsensor:

Sensor für geringe Trägheit (LIS 3)

Nadeloptionen:

Nadelradius von 50 nm bis 25 µm, Nadeln mit hohem Seitenverhältnis (HAR) 200 µm x 20 µm

Messbereich X/Y:

100 mm X 100 mm X/Y, manuelle Nivellierung (manuell / motorisiert)

Messbereich R-Theta:

Kontinuierliche 360 Grad (manuell / motorisiert)

Max. Anzahl Messpunkte:

120.000

Repetierbarkeit der Stufenhöhe:

4 Å, 1 Sigma in Schritten $\leq 1 \mu\text{m}$ (30 Scans mit einer 12,5 µm-Nadel)

Vertikaler Messereich:

1 mm

Vertikale Auflösung:

1 Å (@ 6.55 µm Bereich)

Besondere Merkmale:

Das Gerät ist eingehaust und auf einem Schwingungsdämpfer

Beispielansicht:

Digitale Vergrößerung, vertikales Sichtfeld von 0,275 bis 2,2 mm

Zubehör:

Nadeln verschiedener Radien und Ausführungen, Referenzprobe